作业 2

廖汶锋

2024年4月1日

- 2.3. 根据物质波公式,假设电子动能完全由电场加速获得,电子静止质量 $m_0 = 0.91 \times 10^{-30} \text{kg}$,写出电子物质波波长和加速电压 U 之间的直接 关系,并分别计算 U = 100V、10kV、300kV 时的电子的波长值。
 - **解**. 根据相对论能量、动能 E_k 及动量 p 的关系,可以推导出:

$$p = \sqrt{2m_0 E_k \cdot \left(1 + \frac{E_k}{2m_0 c^2}\right)}$$
 (2.3-1)

结合题目已知条件 $E_k = qU$ 以及德布罗意波公式可得:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 qU \cdot \left(1 + \frac{qU}{2m_0 c^2}\right)}}$$
 (2.3-2)

取普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ 、光速 $c = 2.998 \times 10^8 \text{m/s}$ 、元电荷量 $q = 1.602 \times 10^{-19} C$,并且分别取 U = 100 V、10 kV、300 kV 代人 (2.3-2) 可得:

$$\begin{cases} \lambda_{100\text{V}} = 1.2271\text{Å} \\ \lambda_{10\text{kV}} = 0.1221\text{Å} \\ \lambda_{300\text{kV}} = 0.0197\text{Å} \end{cases} \tag{2.3-3}$$

- 2.4. 为什么 TEM 一般要求样品很薄? (从电子透射率、透镜色差来说明)
 - **解**. 第一,电子透射率 τ 与样品原子数密度 N、散射截面 σ_{α} 、厚度 t 具有以下表达式:

$$\tau = \exp(-N\sigma_{\alpha}t) \tag{2.4-1}$$

由 (2.4-1) 可知,当厚度 t 下降时,透射率提升,有助提升成像衬度。 第二,TEM 的透镜色差 d_c 与电子能量损失 ΔE 成一次方正比关系。 当样品厚度越厚时, ΔE 随之增大,色差散焦斑直径 d_c 越大。 综上所述,样品越薄越有利于 TEM 的成像。

2.5. 为什么在 SEM 中,形貌像一般用二次电子,成分像一般用背散射电子?而不能反过来。

解. SE 模式中,入射电子束与材料表面的夹角 τ 与二次电子产额 δ 满足正割关系,即 $\delta \propto \sec \theta$,所以在尖、棱、角处, η 明显增大;在 沟、槽、孔、穴处,二次电子容易被阻挡, η 明显减少;在平面垂直入射, η 不变。

雖然 SE 模式在不同样品中的 δ 也有差异,但是二次电子的成分衬度和样品的成分、分子键合情况、导电率、表面污染等因素都有关,难以用简单规律描述。所以一般不用 SE 来表现成分像。

BSE 模式中,背散射电子产额 η 与原子序数 Z 有明显的关系。考虑垂直入射、 $E_s = 20 \text{keV}$ 时,两者的关系可用多项式近似:

$$\eta = -0.0254 + 0.016Z - 1.86 \times 10^{-4}Z^2 + 8.3 \times 10^{-7}Z^3$$
 (2.5-1)

由多项式的连续性可知,当样品的原子序数差异较小时,衬度很小; 当样品的原子序数差异很大时,衬度很大,所以 BSE 適合用于表示 成分像。

雖然 BSE 模式亦能成形貌像,但是 η 不仅考虑倾角因素,还要考虑 因素。如果样品表面法线与入射光线的夹角较大时,背散射电子大多数集中于,法线和入射光线的平面内,所以 E-T 检测器在检测期间,有可能会出现"阴影效应"。

2.6. 在电子显微镜,能否同时显示极限分辨率和最大景深,为什么?

解. 两者显然不能同时满足最优解。原因如下:记正确成像的物距为U,透镜半径为R,物方分辨率为 δR ,景深为 ΔU ,由简单的几何关系可以推导得:

$$\frac{\Delta U}{\delta R} = \frac{U/Rw}{\sqrt{1 - \left(\frac{\delta R/2}{R}\right)^2}} \tag{2.6-1}$$

由 (2.6-1) 可知,当分辨率 δR 下降时, $\Delta U/\delta R$ 的值也随之而下降,所以景深 ΔU 也会下降。因此,极限分辨率和最大景深无法同时取得。